

Biblio:

[1] Introduction à l'électronique	DONNINI
[2] Optique Expérimentale	SEXTAN
[3] Dico de Physique Exp IV	DONNINI - QUARANTA
[4] Expériences d'Electronique	DUFFAIT
[5] Dico Physiq. Exp III	DONNINI - QUARANTA

Plan: I. Caractérisation des Semi-conducteurs

1. Influence de la T° sur un SC intrinsèque [4] p110 - [3] p543.
2. Semi-Conducteur extrinsèque - Dopage - Densité de Porteurs [5] - p432.

II. Application: la CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE

1. Caractéristique [2] p85
2. Optimisation du fonctionnement [2] p85
3. Rendement.

INTRO:

Les semi-conducteurs sont des matériaux présentant une conductivité électrique intermédiaire entre les métaux et les isolants. Cela est dû au fait que la bande de conduction des SC est séparée de la Bande de Valence par une bande d'énergie interdite, le gap. Ils conduisent donc moins bien qu'un métal mais mieux qu'un isolant ($E_g \approx 1\text{eV}$ pour SC contre $\approx 6\text{eV}$ pr les isolants). C'est au 19^{ème} siècle que ces propriétés ont été observées (par N. Faraday). Depuis, les SC ont largement "envahis" la vie quotidienne. Ils sont en effet primordiaux en électronique et ce, car ils offrent la possibilité de contrôler la q^{te} de courant et la direc^o du courant qui les traverse.

Le but de ce TP est de mettre en évidence certaines caractéristiques des SC (à savoir l'énergie de gap pour un SC et la densité de porteurs pour un SCE) et d'étudier ensuite un exemple pratique de l'utilisa^o des semi-conducteurs = la cellule photovoltaïque.

I. Caractérisation des Semi-Conducteurs:

1. Influence de la T° sur un semi-conducteur intrinsèque: [3] p543 / [4] p110.

L'agitation thermique dans un SCI permet à des e^- de la Bande de Valeur BV à passer dans la bande de Conduction BC et donc, d'assurer la conduction dans le milieu. (Déplacement des e^- dans BC et des trous de la BV)

La densité volumique d' e^- et de e^+ pour un semi-cond. intrinsèque est fonction de la T° et est donnée par: $n = p = AT^{3/2} e^{-E_g/2kT}$ $E_g = \text{gap à } 0K$.

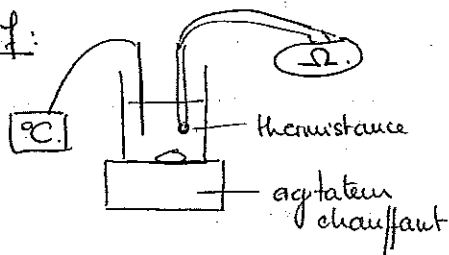
La conductivité du matériau s'écrivant $\sigma = (n\mu_n + p\mu_p)e$ est d'autant plus importante que n et p sont grand donc T .

On cherche à vérifier expérimentalement la loi de dépendance de R avec la température pour une thermistance CTN (coefficient Négatif de T°)

$$R(T) = R_0 e^{\frac{E_g}{2k} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$
 avec $R_0 = \text{résistance à } T_0$.

On s'attend à avoir une exponentielle et en traçant $\ln R = f\left(\frac{1}{T}\right)$ on pourra remonter à E_g .

Dispositif:



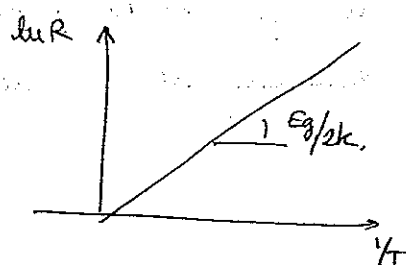
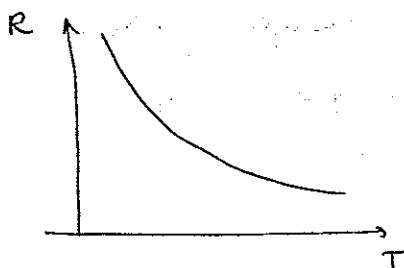
R mesuré à l'ohmmètre

T " au thermomètre num.

Thermistance utilisée: CTN caractérisée par sa valeur à $20^\circ C$ $R = 47 \Omega$ de R .

Rq: Il faut que le courant qui circule dans la thermistance ne soit pas trop élevé pour éviter l'échauffement du matériau.

Mesure: $R = \dots \Omega \pm \dots \Omega$
 $T = \dots \pm \dots ^\circ C$.



$E_g =$

OdG: Pour le Germanium $E_g = 0,66 \text{ eV}$
Silicium $E_g = 1,12 \text{ eV}$

On ne sait pas en quoi est fait la thermistance précisément mais on trouve un bon ordre de grandeur. Pour 1 SC $0,3 \text{ eV} \leq E_g \leq 1 \text{ eV}$

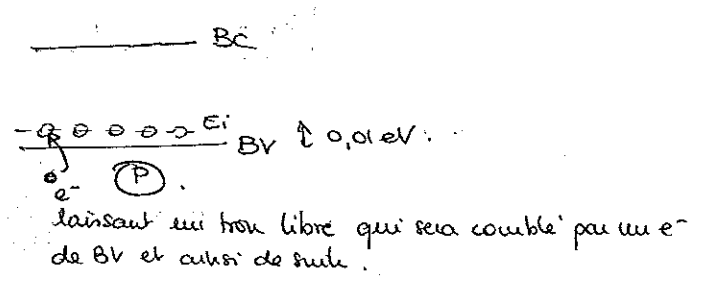
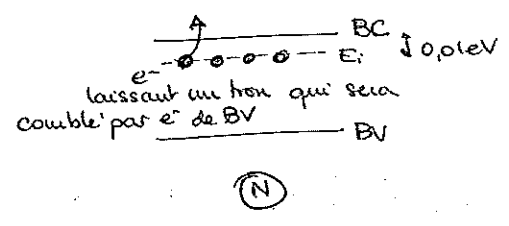
E_g est à comparer avec kT à 300K : $kT = \frac{1}{40} \text{ eV} = 0,025 \text{ eV}$
 $\Rightarrow$ Peu conducteur à T_{amb} .

C'est pourquoi on dope les SC pour qu'ils soient + conducteurs.

Rq: A noter aussi la forte dépdce de R aux T° usuelles $\rightarrow$ thermistances et utilisées cō thermomètre après étalonnage.

2. Semi-conducteurs extrinsèques - Dopage - Densité de porteurs [S] p 432.

On distingue les SC dopés N et dopés P. Le Dopage ajoute un niveau d'énergie intermédiaire (proche de BC pour N et proche de BV pour P - de l'ordre de 0,01 eV) dans la bande interdite. Il est donc plus facile pour les e^-/e^+ de passer de BC/BV. On ajoute des impuretés dites colonnes III et V de la CP.



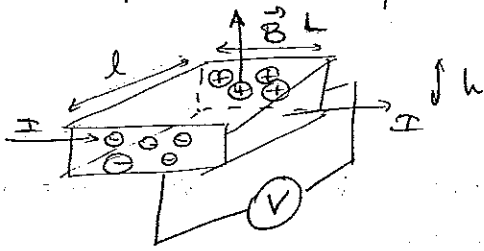
Même une faible quantité d'impuretés modifie grandement le comportement électrique du SC.

Le nbre de porteurs est déterminé par la [] en impureté, c'est pourquoi on parle de conduction EXTRINSÈQUE.

Nous allons étudier cette caractéristique (densité de porteurs) -

Il est en effet possible de mesurer la densité et la mobilité des porteurs dans un échantillon de SC dopé grâce à l'effet Hall.

Les porteurs soumis à un courant et à un chp externe $\vec{B}$ vont être déviés ($\vec{F} = q\vec{v}_d \times \vec{B}$) vers les parois latérales $\Rightarrow$ ddp aux bornes de l'échantillon, V_H .



Porteurs soumis à $F_E = \frac{qV_H}{l}$

$F_B = \frac{IB}{nqh}$

en régime permanent $F_E = F_B \Rightarrow \boxed{V_H = \frac{IB}{nqh}}$

Dispositif: On dispose d'un mex de Germanium dopé n.
(Dimensions: $L \times l \times h = 20 \times 10 \times 1 \text{ mm}$).

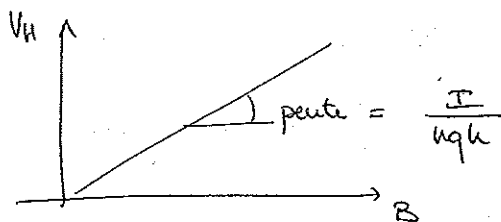
→ On trace d'abord la courbe d'étalonnage $B = f(i)$ pour connaître B de l'électroaimant. (B mesuré au teslamètre)

Rq: Utiliser des pièces plates de l'entrefer pr avoir chp uniforme.

→ On place ensuite le banc de Ge. Il est parcouru par un courant $I = 14,3 \text{ mA}$.

On mesure V_H avec un mV et on trace $V_H = f(B)$.

$i_{\text{aim}} = \dots \Rightarrow B = \dots$
 $V_H = \dots \pm \dots$



$\rightarrow n = \frac{I}{\text{pente} \cdot qh} \quad h = 1 \text{ mm}$

On trouve

$n = \dots$

Ordre: Pour un semi-conducteur intrinsèque: $n \approx 10^{18} \text{ m}^{-3}$
Pour un métal: $n \approx 10^{28} \text{ m}^{-3}$.

Rq: Effet Hall non mesurable avec des métaux (n trop élevée), $\Rightarrow$ utilisation des SC dopés de teslamètres pr mesure de champ (d'où nécessité de connaître les caractéristiques du SC utilisé de la sonde).

On peut également remonter à la mobilité des porteurs de charges en mesurant la conductivité du sc.

En effet $\sigma = nq\mu = \frac{L}{l \cdot h} \frac{1}{R}$

R = résistance du banc mesuré à l'ohmmètre.

$$\Rightarrow \mu = \frac{L}{nq l h R}$$

On mesure $R = \dots$

$$\mu = \dots$$

OdG: pour le Germanium $\mu_n = 3900 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ pour les e^- .

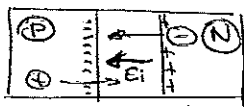
En pratique, on n'utilise pas seulement un sc dope' ou 1 sc dope' P. On fait des associations pour que ce soit encore mieux!

On va donc s'intéresser maintenant à une des (nombreuses) applications de la jonction PN: la cellule photovoltaïque.

II. APPLICATIONS DES SCE: LA CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE:

cellule photovoltaïque = jonction PN.

= élém^t de base du panneau solaire.



système déséquilibré $\rightarrow$ diffusion de l'excès de trou côté N d' e^- côté P.

Zone P se charge < 0

Zone N > 0

$\Rightarrow$ Appari^e d'1 chp E_i qui stoppe la diffusion.

Au centre, zone de depletion dépourvue de porteurs maj.

Si on applique un chp à la j^o: 2 effets:

$\rightarrow$ chp de $\vec{u}$ sens que $\vec{E}_i$ (j^o polarisée en inverse) $\Rightarrow$ on renforce $\vec{E}_i$, zone de depletion agit cō 1 isolant

$\rightarrow$ chp de sens opposé (en direct) $\Rightarrow$ 1 seul pr lequel e^-/e^+ peuvent franchir la zone de depletion $\Rightarrow$ j^o passante.

Une cellule photovoltaïque = photodiode qui fonctionne en générateur.

Les cellules photovoltaïques st optimisées pr fournir la puissance maximale pour un éclairement énergétique dt l

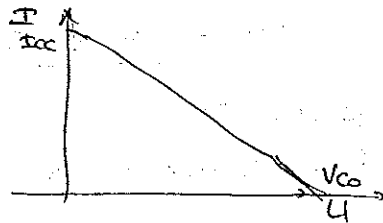
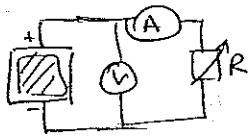
La cellule photovoltaïque reçoit un flux de photons. L'énergie d'un photon absorbé est transférée à un électron de la BV vers BC. Sous l'action du champ régnant dans la jonction, il est collecté et apparaît une ddp aux bornes de la cellule $\sim \frac{E_g}{2q}$ ($\Rightarrow$ tension d'autant + gde que E_g gde)

De plus + le gap est petit, + il y aura de photons qui auront energies suffisantes pour exciter les électrons. $\Rightarrow$ + E_g petit, + courant $\uparrow$.

ex: compromis à faire sur E_g pour avoir une puissance max.
En général, on prend du Si ($E_g \approx 1,1 \text{ eV}$).

1. Caractéristique : [2] p85

On trace I en foncⁿ de V pour un même éclairement Φ .

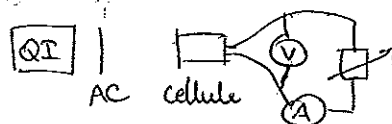
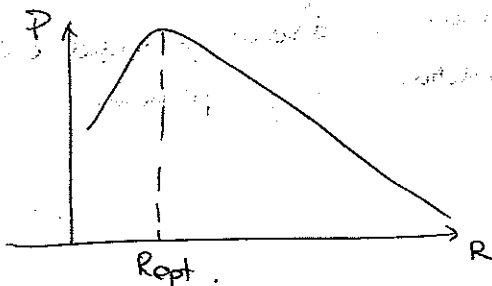


2. Optimisaⁿ du fonctionnement de la cellule. [2] p85.

On se propose de mesurer la valeur de la charge adaptée ie la valeur de la charge pour laquelle la puissance électrique obtenue est maximale.

Pour avoir un ordre d'idée de la valeur de R on estime sa valeur en faisant le rapport $\frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{\text{tension en circuit ouvert}}{\text{intensité de court circuit}} \approx \frac{500 \text{ mV}}{5 \text{ mA}} \approx 100 \Omega$.

On fait varier R de 0 à 400Ω et on trace $P = f(R)$. sous éclairage est.



3. calcul du rendement.

A $R = R_{opt}$. On mesure $I_L =$
 $I =$

$$\Rightarrow P_{delivree} =$$

Au luxmètre on mesure le $\Phi_{inc} =$ klux

On converti les klux en watt sachant que la surface de la cellule
vaut $S = 1,13 \cdot 10^{-3} m^2$ et que $1 \text{ lux} = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ watt} \cdot m^{-2}$

La puissance d'éclairement vaut donc $P_{eclair} = \Phi (\text{klux}) \times 1,5 \times S$

$$P_{eclair} =$$

$$\eta = \frac{P_{eclair}}{P_{delivree}} \times 100.$$

$$\Rightarrow \eta = \boxed{}$$

CEL: c'est faible (voire très faible) $\Rightarrow$ c'est pq on fait des associations
série / parallèle pour fabriquer les panneaux solaires. où on arrive à
des rendem' de 15 à 20%.

CONCLUSION:

Ce qu'il faut retenir de ce TP c'est qu'on a pu remonter à
des grandeurs microscopiques caractéristiques des semi-conducteurs.
et cela leur confèrent leur propriétés électriques remarquables.
De ce fait ce sont des bons candidats, on l'a vu, pour des
instruments thermométriques, pour des mesures de champ, des
détecteurs de particules sans oublier les composants électroniques
(diode, transistor)

January 1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900

1899-1900